### 顕微鏡システム

#### MICROSCOPE SYSTEM

### INCORPORATION BY REFERENCE

The disclosure of the following priority application is herein incorporated by reference:

Japanese Patent Application No. 2002-221520 filed July 30, 2002

### BACKGROUND OF THE INVENTION

- Field of the Invention
  本発明は、オートフォーカス装置を備えた顕微鏡に関する。
- 2. Description of Related Art

顕微鏡のオートフォーカス装置として、画像コントラスト式のオートフォーカス装置(AF装置)が知られている。このAF装置は、撮像した画像のコントラストを検出しながら試料ステージを上下方向(z軸方向)に移動し、コントラスト値が最大になるZ座標を合焦位置とする。AF装置は検出した合焦位置までステージを移動し、合焦動作を完了する。

一般的に、撮像画像のコントラストを検出するためにAF装置がステージを移動する Z 軸方向の範囲(サーチ範囲)に対して、高いコントラストが得られる範囲は非常に小さい。ステージをサーチ範囲に渡って移動するには時間を要するため、AF動作の開始からステージを合焦位置まで移動して停止させるまでの時間を短縮することが難しい。一方、AF動作の所要時間を短縮するためにサーチ範囲を極端に狭くすると、標本によってはサーチ範囲の外側に合焦範囲が存在する可能性もでてくる。

# SUMMARY OF THE INVENTION

本発明は、素早く合焦位置を検出することができるAF装置を備えた顕微鏡システムを提供する。

本発明による顕微鏡システムは、標本を搭載するステージと、ステージに搭載された標本の像を形成する結像光学系と、結像光学系によって形成された標本の像を撮像する撮像装置と、撮像装置によって撮像された標本の画像に基づいて、標本の合焦位置を検出する合焦位置検出装置と、合焦位置検出装置によって検出された合焦位置を記憶する合焦位置記憶装置とを有し、合焦位置検出装置は、合焦動作を行うたびに、合焦位置記憶装置に記憶された合焦位置を中心としたサーチ範囲を設定し、設定したサーチ範囲でステージと結像光学系とを相対的に移動して新たに合焦位置を検出する。

合焦位置記憶装置の記憶内容をリセットするためのリセット動作を検出するリセット動作検出装置をさらに備え、合焦位置検出装置は、リセット動作検出装置によってリセット動作が検出されるまで、合焦動作を行うたびに合焦位置記憶装置に記憶された同一の合焦位置を利用してサーチ範囲を設定することが好ましい。

リセット動作検出装置は、リセット動作として、ステージからの標本の取り外しを検出してもよい。少なくともステージ、結像光学系、および撮像装置を収容するハウジングをさらに備え、ステージは、標本を載置する載物台と、ハウジングに設けられた開口を介して載物台をハウジング内に挿入およびハウジングから排出する移動部とを有し、リセット動作検出装置は、リセット動作として、ハウジングからの載物台の排出動作を検出してもよい。

合焦位置検出装置は、合焦動作を行う際に、合焦位置記憶装置に合焦位置が記憶されていない場合は、サーチ範囲よりも広い初期サーチ範囲で合焦位置を検出することが好ましい。標本がステージに配置されたときのステージの初期位置を記憶する位置記憶装置をさらに備え、合焦位置検出装置は、初期サーチ範囲で合焦位置を検出できない場合は、ステージを初期位置記憶装置に記憶された初期位置まで移動してもよい。合焦位置検出装置は、設定したサーチ範囲で合焦位置を新たに検出できない場合は、ステージを合焦位置記憶装置に記憶された合焦位置まで移動してもよい。

合焦位置検出装置は、リセット動作検出装置によってリセット動作が検出 されると、合焦位置記憶装置の記憶内容を消去することが好ましい。

標本を保持するスライドガラスの交換動作を検出するスライドガラス検出装置と、スライドガラスに付与された固有の識別情報を検出する識別情報検出装置によって検出される識別情報を記憶する識別情報記憶装置と、スライドガラス検出装置の検出信号に基づいて、(1)スライドガラスの取り外し動作が検出された場合は、識別情報検出装置によって検出されたスライドガラスの識別情報と、合焦位置検出装置によって検出された合焦位置とを関連づけて識別情報記憶装置に記憶し、(2)スライドガラスの装着動作が検出された場合は、識別情報記憶装置から、識別情報検出装置によって検出されるスライドガラスの識別情報に対応する合焦位置を読み出し、読み出した合焦位置を合焦位置記憶装置に記憶する制御装置とをさらに備えてもよい。

撮像装置によって撮像された画像のコントラスト値を検出するコントラスト検出装置をさらに備え、合焦位置検出装置は、コントラスト検出装置によって検出されるコントラスト値に基づいて、標本の合焦位置を検出することが望ましい。

本発明によるオートフォーカス装置は、撮像装置と接続する接続部と、撮像装置は顕微鏡のステージに搭載され結像光学系を介して結像する標本の像を撮像して撮像画像のコントラスト値を検出し、接続部を介して取得されるコントラスト値に基づいて、標本の合焦位置を検出する合焦位置検出装置と、合焦位置検出装置によって検出された合焦位置を記憶する記憶装置と、記憶装置の記憶内容をリセットするためのリセット動作を検出するリセット動作検出装置とを有し、合焦位置検出装置は、(1)記憶部に記憶された合焦位置を中心としたサーチ範囲を設定し、設定したサーチ範囲でステージを結像光学系の光軸方向に移動して新たに合焦位置を検出するような指令を出力し、(2)リセット動作検出装置によってリセット動作が検出されると、記憶装置の前記記憶内容を消去する。

本発明による顕微鏡システムは、標本に対する対物レンズの合焦位置を検

出する合焦位置検出装置と、合焦位置検出装置によって検出される合焦位置に関する情報を記憶する合焦位置記憶装置と、合焦位置記憶装置に記憶された合焦位置情報に基づいてサーチ範囲を決定し、サーチ範囲内で合焦位置検出動作を行うよう合焦位置検出装置を制御するサーチ装置と、合焦位置記憶装置に記憶された合焦位置情報をリセットするリセット装置と、合焦位置情報が合焦位置記憶装置に一旦記憶されると、リセット装置が作動するまで合焦位置記憶装置に合焦位置情報を維持させる制御装置とを有する。

標本を保持するスライドガラスの交換動作を検出するスライドガラス検出装置と、スライドガラスに付与された固有の識別情報を検出する識別情報を検出する識別情報を記憶する識別情報記憶装置とをさらに備え、スライドガラス検出装置によってスライドガラスの取り外し動作が検出された場合、(1)制御装置は、識別情報検出装置によって検出されたスライドガラスの識別情報と、合焦位置検出装置によって検出された合焦位置情報とを関連づけて識別情報記憶装置に記憶し、(2)リセット装置は、合焦位置記憶装置の合焦位置情報をリセットし、スライドガラス検出装置によってスライドガラスの装着動作が検出された場合、制御装置は、識別情報記憶装置から、識別情報検出装置によって検出されるスライドガラスの識別情報に対応する合焦位置情報を読み出し、読み出した合焦位置情報を合焦位置記憶装置に記憶することが好ましい。

本発明による顕微鏡のオートフォーカス制御方法は、ステージに搭載された標本の像を撮像し、撮像された標本の画像から、対物レンズに対する標本の合焦位置を検出し、記憶装置に合焦位置を記憶し、合焦動作の開始が指示されると、記憶装置に記憶された合焦位置を中心としたサーチ範囲内で、ステージと対物レンズとを相対的に移動して新たに合焦位置を検出する。標本が対物レンズの光軸上から取り除かれると、記憶装置に記憶された合焦位置の情報を消去することが好ましい。

### BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

図1は、本発明の第1の実施の形態のAF装置を備えた顕微鏡システムの

全体構成を示す図である

図2は、図1に示す顕微鏡システムのAF動作の処理手順を示すフローチャートである。

図3は、図1の顕微鏡システムのステージの上面図である。

図4は、図3に示すステージの標本ホルダがスライドガラスを保持している状態の上面図である。

図5は、図3に示すステージの標本ホルダがスライドガラスを保持していない状態の上面図である。

図6は、スライドガラス上の標本を示す図である。

図7は、AF動作の際の、ステージの2方向のサーチ範囲を示す図である。

図8は、本発明の第2の実施の形態のAF装置を備えた顕微鏡システムの 全体構成を示す図である。

図9は、図8に示す顕微鏡の内部構造を示す切り欠き斜視図である。

図10は、本発明の第3の実施の形態のAF装置を備えた顕微鏡システム、とくに顕微鏡の構成を示す切り欠き斜視図である。

図11は、第3の実施の形態の顕微鏡システムで用いるスライドガラスと そのバーコードを示す上面図である。

図12は、第3の実施の形態の顕微鏡システムのAF動作の処理手順を示すフローチャートである。

図13は、第3の実施の形態の顕微鏡システムのAF動作の処理手順を示すフローチャートである。

図14は、画像コントラスト式のAF装置においてAF動作を行う際に得られるコントラスト値と、ステージのZ座標との関係の一例を示す図である。

### DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENTS

### - 第1の実施の形態-

本発明の第1の実施の形態による顕微鏡システムについて図1~図7を 用いて説明する。

図1に示すように第1の実施の形態の顕微鏡システムは、顕微鏡10と、

オートフォーカス(AF)装置とを有する。AF装置は、顕微鏡10に接続されたカメラヘッド31、画像処理装置33、およびテレビモニタ34を備えている。顕微鏡10は、標本を搭載するステージ20、対物レンズ14、鏡筒16,接眼レンズ17,直筒18、光源12,コンデンサレンズ13、および、これらを支持する本体11を備えている。なお、対物レンズ14,鏡筒16および直筒18が、ステージ20に搭載された標本の像を形成する結像光学系を構成し、対物レンズ14,鏡筒16および接眼レンズ17が、ユーザが直接、標本を観察するための観察光学系を構成する。

AF装置のカメラヘッド31は、直筒18に取り付けられている。また、本体11の内部には、ステージ20を対物レンズ14の光軸方向、すなわち鉛直方向(z軸方向)に移動させるためのステージ駆動部21が備えられている。ステージ駆動部21はステージ20を駆動するモータおよび機構部を備え、信号ライン22を介して画像処理装置33に接続されている。AF装置が動作している際は、ステージ駆動部21は画像処理装置33の出力信号に応じてモータの駆動を制御する。AF装置は、モータの駆動によりステージ20をz軸方向に移動させて合焦位置のサーチを行う。

図3に示すように、ステージ20には標本ホルダ21が2つのクランプネジ24により固定されている。ステージ20は、標本ホルダ21を図示のx 方向およびy方向にそれぞれ移動させる機構を有している。

標本ホルダ21は、図4および図5に示すように固定爪22および可動爪23を備える。標本ホルダ21は、バネ機構23aで付勢された可動爪23と固定爪22との間に、試料として標本を搭載したスライドガラス1をはさみ込むことにより、スライドガラス1を保持する。固定爪22には、検出レバー32を備えたマイクロスイッチ31が固定されている。マイクロスイッチ31は、図4に示すように検出レバー32がスライドガラス1によって押し込まれた位置にあるか、または図5に示すように検出レバー32が開放されて突出した位置にあるかを検出することにより、スライドガラス1が標本ホルダ21に装着されているか否かを検出することができる。

このような顕微鏡システムにおいて、試料としてスライドガラス1とカバ

ーガラスに挟んだ標本を、ステージ20上の標本ホルダ21に保持させ観察する場合、光源12から出射された光は、コンデンサレンズ13で集光され、スライドガラス1上の標本に照射される。標本からの反射光は、対物レンズ14、鏡筒16および直筒18等の結像光学系を経て、カメラヘッド31に内蔵されているCCD撮像面(不図示)に光学像として結像する。標本の光学像はCCDにより画像信号に変換され、信号ライン32を介して画像処理装置33に送られる。画像処理装置33は、画像をテレビモニタ34に映像として表示させる。また、接眼レンズ17によりユーザが直接標本像を観察することもできる。

以下、AF装置の合焦動作について図2、図6,および図7を用いて説明する。

まず、AF装置において実行する画像コントラスト方式のAF動作について、簡単に説明する。画像コントラスト式のAF装置は、撮像した標本の画像のコントラストを検出しながらステージ20をZ軸方向に移動し、撮像画像のコントラスト値が最大になるZ座標を合焦位置とする。

AF装置は、例えばステージ20をz軸のプラス方向に移動しながら、検出した撮像画像のコントラストをプロファイルする。図14に、z軸方向のステージ位置とコントラスト値との関係を示す。AF装置は、図14に示すような山形のプロファイルからコントラスト最大値のZ座標Zfを求める。そして、AF装置は、算出した座標Zfまでステージ20をz軸のマイナス方向に移動させる。このように、ステージ20を合焦位置の座標Zfに位置決めして合焦動作が完了する。

画像処理装置33は、CPU33bとメモリ33cとを内蔵する。CPU33bは、コントラスト検出機能およびAF機能を有する。具体的には、CPU33bは、メモリ33c内に予め格納されたコントラスト検出プログラムを読み込んで実行し、カメラヘッド31が取り込んだ画像を処理して、画像のコントラストを検出する。また、CPU33bは、メモリ33c内に予め格納されたAF制御プログラムを読み込んで実行し、ステージ20を最終的に合焦位置に移動させてAF動作を行う。

画像処理装置33の筐体には、ユーザによるAF動作の開始の指示を受け付けるためのAFボタン33aが備えられている。メモリ33c内には、合焦位置のZ座標を格納するための領域(以下、ピント位置メモリ33dと称する)と、AF動作開始前のZ座標を格納するための領域(以下、初期値メモリ33eと称する)とが設けられている。

AF装置におけるAF動作について、図2のフローチャートを用いて説明する。まず、ユーザはステージ20の不図示のX, Y駆動機構を操作して、標本を×軸方向およびy軸方向に移動する。ここでは、図6に示すように、スライドガラス1とカバーガラス2に挟まれた標本601の点A(X1, Y1)を対物レンズ14に対向させた状態で、観察を開始する場合について説明する。なお、この段階では、点Aは対物レンズ14には合焦しておらず、点AのZ座標は座標Z0にある。この時点でのZ座標Z0を、図7に示すようにステージ20の初期位置とする。

ステップS201でCPU33bは、AFボタン33aがオンされたか否かを判定する。ユーザがAFボタン33aを押下することによりAF動作の開始を指示した場合には、ステップS202へ進む。ステップS202でCPU33bは、ピント位置メモリ33d内にすでに合焦位置のZ座標が格納されているか否かを判定する。合焦位置のZ座標が格納されていない場合には、ステップS206へ進む。ステップS206では、現在の点AのZ座標Z0を初期値として初期値メモリ33eに格納し、ステップS207へ進む。ステップS207では、サーチ範囲を設定する。サーチ範囲は、標本601の撮像画像のコントラストを検出するためにステージ20をz軸方向に

移動する範囲である。ここでは、サーチ範囲を設定するために、予め設定した Z 座標 Z min、 Z maxをメモリ 3 3 c から読み出す。座標 Z minと座標 Z max は、ステージ 2 0 の可動範囲内で予め定められた絶対座標である。座標 Z min から座標 Z maxまでの距離は、スライドガラス 1 の厚さの規格が 0 . 9 m m から 1 . 2 m m であることを考慮して、例えば 0 . 5 0 m m に設定する。サーチ範囲を設定した後、ステップ S 2 0 4 へ進む。

ステップ204でCPU33bは、ステージ駆動部21に制御信号を出力

し、設定したサーチ範囲、すなわち座標 Z minから座標 Z maxに渡ってステージ20を移動させる。ステップS205でCPU33bは、ステージ20が座標 Z minから座標 Z maxまで移動している間、予め定めたサンプリング間隔でカメラヘッド31が取り込んだ画像のコントラストを検出する。CPU33bは、検出したコントラスト値とステージ20のZ座標との関係をプロファイルする。

つづくステップS208でCPU33bは、ステップS205で得られたプロファイルが有効であるか否かを判定する。具体的には、図14に示すようにコントラスト値の高い山形のプロファイルが存在し、サーチ範囲内に合焦位置が含まれているか否かを判定する。山形のプロファイルが含まれている場合は、ステップS209へ進む。

ステップS209では、コントラスト値のピーク位置のZ座標Zf=Z1を求め、座標Z1を点Aの合焦位置とする。ステップS210でCPU33 b は、検出した合焦位置の座標Z1までステージ20を移動させるように、ステージ駆動部21に制御信号を出力する。ステージ20は、ステージ駆動部21のモータの駆動により合焦位置の座標Z1まで移動して停止する。これにより、ユーザは対物レンズ14が標本301の点Aに合焦した状態で観察を行うことができる。

ステップS215でCPU33bは、ピント位置メモリ33dに合焦位置の Z 座標のデータが既に格納されているか否かを判定する。ここでは、まだピント位置メモリ33dには Z 座標は格納されていないので、ステップS215が否定判定されてステップ216へ進む。ステップS216で C P U 3 3 b は、ステップ209で検出した合焦位置の座標 Z 1 をピント位置メモリ33 d に格納する。

つぎに、ステップS218でCPU33bは、マイクロスイッチ31からの信号に基づいて、スライドガラス1が標本ホルダ21に装着されているか否かを判定する。スライドガラス1が装着されている場合には同じ試料で観察が続行されていると判断し、ステップ201に戻る。

次に、標本ホルダ21にスライドガラス1が装着された状態で再びAF動

作を行う場合について説明する。例えばユーザが図6に示すように観察位置を点A(X1、Y1)から点B(X2、Y2)にずらした後、点BでAF動作を実行する場合、またはユーザが自らステージ20をz方向に移動した後、再度点AでAF動作を実行する場合、ユーザは再びAFボタン33aを押す。ステップS201でAFボタン33aがオンされたことが検出されると、ステップS202でCPU33bは、ピント位置メモリ33dに合焦位置の乙座標が格納されているか否かを判定する。ピント位置メモリ33dには、先ほどステップS216で格納した座標乙1が記憶されているので、今度はステップS203に進む。ステップS203では、ピント位置メモリ33dに格納されている座標乙1を読み出した座標乙1を中心に予め定めた範囲を設定して、サーチ範囲を決定する。具体的には、ピント位置メモリ33dに格納されている座標乙1に予め定めた値、例えば±20μmを加えることにより、座標(乙1-20μm)から座標(乙1+20μm)の範囲をサーチ範囲として決定する。なお、ステップS203で設定したサーチ範囲は、ピント位置メモリ33dに合焦位置が記憶されていない場合にステッ

つぎにステップS204において、ステップS203で設定したサーチ範囲(Z1±20μm)に渡って、ステージ20を移動させる。ステップS205では、サーチ範囲における撮像画像のコントラストを検出し、プロファイルを得る。ステップS208で山形のプロファイルが含まれていると判定されると、ステップS209でコントラスト値のピークのZ座標を検出することにより、あらたな合焦位置の座標Z2を求める。ステップS210では、ステップS209で求めた合焦位置の座標Z2までステージ20を移動させて停止する。これにより標本601の所望の観察位置を合焦状態で観察を行うことができる。

プS207で設定したサーチ範囲(0.5mm)の10分の1以下の狭い範

囲である。

なお、この場合は、既にピント位置メモリ 3 3 d に点 A の合焦位置の座標 Z 1 が格納されているので、ステップ S 2 1 5 が肯定判定され、今回設定した座標 Z 2 の格納は行わずにステップ 2 1 8 に進む。スライドガラス 1 が標

本ホルダ21から外されていなければ、ステップS218が否定判定され、 同じ試料で観察を続行していると判断して、ステップS201に戻る。

また、ステップS208が否定判定され、撮像画像のコントラストのプロファイルが有効でない場合、すなわち山形のプロファイルが得られなかった場合は、ステップS211へ進む。この場合、対物レンズ14がスライドガラス1上で標本の存在しない部分を観察していると考えられる。そこで、ステップS211でCPU33bは、対物レンズ14の光軸上に標本が存在しないことを知らせるエラー表示をモニター34に表示させる。

その後、ステップS212でCPU33bは、ピント位置メモリ33dに合焦位置の座標が格納されているか否かを判定する。ステップS212が肯定判定され、合焦位置の座標Z1がメモリ33dに格納されている場合は、ステップS213へ進む。ステップS213では合焦位置の座標Z1を読み出して、ステージ20を座標Z1に移動させる。一方、ステップS212が否定判定され、ピント位置メモリ33dに合焦位置の座標が格納されていない場合は、ステップS214へ進む。ステップS214では、初期値メモリ33eに格納されているステージ20の初期座標Z0を読み出し、ステージ20を初期座標Z0に移動する。これにより、有効なプロファイルが得られなかった場合でも、ステージ20を同じ試料についての前回以前の合焦位置の座標Z1、もしくは初期位置Z0に戻すことができる。

なお、ステップS218が肯定判定され、スライドガラス1が標本ホルダ 21から外されたことを検出した場合には、ステップS219へ進む。メモ リ33d、33eに格納された合焦位置の座標Z1および初期値Z0は別の 試料には使えないため、ステップS219でCPU33bは、ピント位置メ モリ33dおよび初期値メモリ33e内のデータをすべて消去する。

以上説明したように、ピント位置メモリ33dに合焦位置の座標が格納されている場合には、合焦位置のサーチ範囲を小さくすることができる。すなわち、メモリ33dに既に合焦位置の座標が格納されている場合は、スライドガラス1が取り替えられておらず、同じ標本601について再びAF動作を行おうとしていることを意味する。したがって、標本601の厚さのばら

つきによる合焦位置のずれのみを考慮すればよいため、予め設定した初期のサーチ範囲よりも大幅に狭い範囲を新たなサーチ範囲として設定することができる。これにより、同じ試料について行う2回目以降のAF動作を高速で行うことができる。

このように、第1の実施の形態の顕微鏡システムは、ある試料に対する1回目のAF動作で検出した合焦位置の座標 Z 1 を、ピント位置メモリ 3 3 d に格納する。ユーザが同じ試料について X、 Y座標を移動させた場合、または同じ X, Y座標であってもユーザが標本の Z座標を移動させた場合には、メモリ 3 3 d に記憶された合焦位置の座標 Z 1 を中心として、新たなサーチ範囲を設定する。新たなサーチ範囲は、初期のサーチ範囲に比べて十分に狭く設定される。同じ試料に対する 2 回目以降の AF動作は、新たに設定した狭いサーチ範囲内でコントラストの検出を行うため、素早く合焦位置を検出することができる。また、スライドガラス 1 上の標本がない部位でユーザが AF動作を行わせた場合でも、ステージ 2 0 を 1 回目の合焦位置の座標 Z 1 もしくは初期座標 Z 0 に戻すことができる。

試料が別の試料に交換された場合には、ピント位置メモリ33d、および初期値メモリ33eに記憶されたデータを消去するため、試料ごとに合焦位置の2座標をリセットすることができる。

上述の第1の実施の形態では、試料が交換されるまで、1回目のAF動作で検出した合焦位置の座標 Z 1 をピント位置メモリ 3 3 d に格納し続けた。ただし、AF動作を行うたびに、ピント位置メモリ 3 3 d に記憶する Z 座標を更新するよう構成することもできる。具体的には、図 2 のフローチャート

のステップS215が肯定判定された場合に、今回のAF動作で検出した合 焦位置のZ座標、例えば2回目の合焦位置の座標Z2をピント位置メモリ3 3 dに格納し、合焦位置のZ座標を更新する。その後、ステップS218へ 進む。

#### - 第2の実施の形態-

つぎに、本発明の第2の実施の形態の顕微鏡システムを、図8および図9を用いて説明する。

図8および図9に示すように、第2の実施の形態による顕微鏡システム810は、顕微鏡の構成要素、すなわち光源12、コンデンサレンズ13、ステージ20、対物レンズ14、第2対物レンズ15等の光学系およびステージ20の駆動機構を、全て箱状のハウジング41に収めている。また、顕微鏡システム810は、接眼レンズ17は備えず、撮像素子32を内蔵している。撮像素子32によって取得した標本の画像信号は、ハウジング41内に配置された画像処理部33で処理される。顕微鏡システム810は、画像処理部33で処理した標本の画像をモニタ34に写しだすように構成されている。ステージ20の移動、合焦動作、倍率の切換等の駆動機構は、全て電動化されている。ユーザは付属のコントロールパット36を操作することにより、AF動作の開始を指示することができる。

ステージ20は、y軸方向に移動するクロスローラガイド25の上にx軸方向に移動するクロスローラガイド26が搭載された形状となっている。ステージ20は、それぞれのクロスローラガイド25,26に対して、ステッピングモータ(不図示)とリードネジ(不図示)を備えている。x軸方向のクロスローラガイド26には載物台27が搭載されている。載物台27は、クロスローラーガイド25,26によって、x軸方向、y軸方向に電動駆動させることができる。また、y軸方向クロスローラガイド25は、不図示の2軸方向の駆動機構に搭載され、モータによりz軸方向に駆動することができる。

載物台27には、スライドガラス1を保持する矩形の開口部が設けられて

いる。ステージ20は、x軸方向の可動範囲が大きくとられている。したがって、載物台27のスライドガラス保持部の全てを、ハウジング41のスリット状の開口部41aからハウジング41の外まで移動することができる。ユーザが、付属のコントロールパッド36によりモニタ34のディスプレイに表示されているローディングボタン35をクリックすると、載物台27を開口41aからロード(外部からハウジング41内への引き込み)、またはアンロード(ハウジング41から外部への吐き出し)を行うことができる。

画像処理部33の動作は、第1の実施の形態で説明した画像処理装置とほぼ同様である。ただし、第2の実施の形態では、載物台27のローディングの操作を標本交換と判断する。具体的には、第1の実施の形態で説明した図2のフローチャートのステップS218でスライドガラス1が外されたか否かを判定するために、CPU33bは、ユーザが載物台27のアンロードの操作を行ったか否かを判定する。ユーザがコントロールパッド36によりアンロード操作を行った場合には、ステップS219へ進んでピント位置メモリ33dのデータを消去する。これにより、上述した第1の実施の形態と同様の効果が得られる。

なお、第2の実施の形態の顕微鏡システムにおいて、載物台27にスライドガラス1が装着されているか否かを検出するための、例えば第1の実施の形態と同様の検出部を配置することも可能である。この場合、CPU33b は、検出部の検出結果により、図2のステップS218でスライドガラス1が外されたか否かを判定する。

### - 第3の実施の形態-

本発明の第3の実施の形態による顕微鏡システムを、図10~図13を用いて説明する。

図10に示すように、第3の実施の形態による顕微鏡システム1010は、 上述した第2実施の形態の顕微鏡システム810と同様の構成である。ただ し、顕微鏡システム1010は、ハウジング41の開口41aの内側に、ス ライドガラス1に付されたバーコード等の識別記号を読み取る読みとり部 42をさらに備えている。図11に示すように、スライドガラス1にはスラ イドガラス1ごとの固有の記号であるバーコード3が添付されている。顕微鏡システム1010は、バーコード3が添付されたスライドガラス1を用いることにより、載物台27に搭載されたスライドガラス1を特定することができる。

第3の実施の形態では、ハウジング41内の画像処理部33は、メモリ33c内に、ピント位置メモリ33dと初期値メモリ33eに加えて、バーコード3の情報と合焦位置のZ座標とを対応させたテーブルを格納するための領域であるバーコード情報メモリ33fを有している。

図12および図13に、第3の実施の形態による画像処理部33の動作のフローチャートを示す。第3の実施の形態による画像処理部33における処理は、上述した第1の実施の形態とほぼ同様である。ただし、第3の実施の形態においては、コントロールパッド36の操作によるAF動作の開始指示を検出する前に、スライドガラス1のバーコード3の読み取りを行う。

ユーザが付属のコントロールパッド36で試料をロードする操作をすると、ステップS1201で画像処理部33のCPUは、読みとり部42にバーコード3の読みとりを指示する。ステップS1202では、読みとったバーコード情報をバーコード情報メモリ33fのテーブルに参照し、同じバーコード情報が格納されているか否かを判定する。ステップS1202が肯定判定され、同じバーコード情報がメモリ33fにある場合は、ステップS1203へ進む。

ステップS1203では、読み取ったバーコード情報に対応する Z 座標の情報をメモリ33 f から読み出す。ここで読み出した Z 座標は、同じスライドガラス1について前回以前の A F 動作で検出し、格納した合焦位置の Z 座標である。そこで、C P U は、バーコード情報に対応する Z 座標をピント位置メモリ33 d に格納する。この後、ステップS201に進む。ステップS201~S218における処理は、上述した第1の実施の形態で説明した図2のフローチャートにおける処理と同様である。

あるスライドガラス1について以前にAF動作を行っている場合は、ステップS203において、メモリ33dに記憶された合焦位置のZ座標を用い

てサーチ範囲を決定する。これにより、前回の合焦位置の Z 座標を中心とした狭い範囲をサーチして素早く合焦位置を検出することができる。

図13のステップS218が肯定判定され、載物台27がアンロードされたことを検出した場合、もしくはスライドガラス1が外されたことを検出した場合には、ステップS1301に進む。ステップS1301では、ステップS1201で検出したバーコード情報と同じ情報がバーコード情報メモリ33 f に格納されているか否かを判定する。ステップS1301が否定判定されると、ステップS1302へ進む。ステップS1302では、ピント位置メモリ33 d に現在格納されている Z 座標をバーコード情報と対応させて、バーコード情報メモリ33 f に格納する。その後、ステップS219に進み、ピント位置メモリ33 d 内のデータを消去する。

これにより、次回、同じスライドガラス1が載物台27に搭載された場合には、AF動作を行う際に今回格納したZ座標をステップS1203で読み出して用いることができる。

このように、第3の実施の形態の顕微鏡システムによれば、スライドガラス1ごとに固有の合焦位置の2座標を記憶することができる。これにより、過去にスライドガラス1についてAF動作を行っていれば、狭い範囲のサーチで素早く合焦位置を検出することができる。

上記第1から第3の実施の形態では、試料の合焦位置を検出するために、ステージ20をz軸方向に移動したが、ステージ20は固定として対物レンズ14を含む結像光学系を光軸に沿って移動することも可能である。

上記第1の実施の形態においては、図1に示すように画像処理装置33を顕微鏡10から独立して設けたが、これには限定されず、画像処理装置33を顕微鏡10の本体11の内部に収めてもよい。

The above-described embodiments are examples, and various modifications can be made without departing from the spirit and scope of the invention.

What is claimed is:

# 1. 顕微鏡システムは、

標本を搭載するステージと、

前記ステージに搭載された前記標本の像を形成する結像光学系と、

前記結像光学系によって形成された前記標本の像を撮像する撮像装置と、 前記撮像装置によって撮像された前記標本の画像に基づいて、前記標本の 合焦位置を検出する合焦位置検出装置と、

前記合焦位置検出装置によって検出された前記合焦位置を記憶する合焦位置記憶装置とを有し、

前記合焦位置検出装置は、合焦動作を行うたびに、前記合焦位置記憶装置に記憶された前記合焦位置を中心としたサーチ範囲を設定し、設定した前記サーチ範囲で前記ステージと前記結像光学系とを相対的に移動して新たに前記合焦位置を検出する。

# 2. 請求項1に記載の顕微鏡システムは、

前記合焦位置記憶装置の記憶内容をリセットするためのリセット動作を検出するリセット動作検出装置をさらに備え、

前記合焦位置検出装置は、前記リセット動作検出装置によって前記リセット動作が検出されるまで、合焦動作を行うたびに前記合焦位置記憶装置に記憶された同一の合焦位置を利用して前記サーチ範囲を設定する。

### 3. 請求項2に記載の顕微鏡システムにおいて、

前記リセット動作検出装置は、前記リセット動作として、前記ステージからの前記標本の取り外しを検出する。

#### 4. 請求項2に記載の顕微鏡システムは、

少なくとも前記ステージ、前記結像光学系、および前記撮像装置を収容するハウジングをさらに備え、

前記ステージは、前記標本を載置する載物台と、前記ハウジングに設けられた開口を介して前記載物台を前記ハウジング内に挿入および前記ハウジングから排出する移動部とを有し、

前記リセット動作検出装置は、前記リセット動作として、前記ハウジングからの前記載物台の排出動作を検出する。

### 5. 請求項1に記載の顕微鏡システムにおいて、

前記合焦位置検出装置は、合焦動作を行う際に、前記合焦位置記憶装置に 前記合焦位置が記憶されていない場合は、前記サーチ範囲よりも広い初期サ ーチ範囲で前記合焦位置を検出する。

### 6. 請求項5に記載の顕微鏡システムは、

前記標本が前記ステージに配置されたときの前記ステージの初期位置を記憶する初期位置記憶装置をさらに備え、

前記合焦位置検出装置は、前記初期サーチ範囲で前記合焦位置を検出できない場合は、前記ステージを前記初期位置記憶装置に記憶された前記初期位置まで移動する。

### 7. 請求項1に記載の顕微鏡システムにおいて、

前記合焦位置検出装置は、設定した前記サーチ範囲で前記合焦位置を新たに検出できない場合は、前記ステージを前記合焦位置記憶装置に記憶された前記合焦位置まで移動する。

### 8. 請求項2に記載の顕微鏡システムにおいて、

前記合焦位置検出装置は、前記リセット動作検出装置によって前記リセット動作が検出されると、前記合焦位置記憶装置の記憶内容を消去する。

#### 9. 請求項1に記載の顕微鏡システムは、

前記標本を保持するスライドガラスの交換動作を検出するスライドガラ

ス検出装置と、

前記スライドガラスに付与された固有の識別情報を検出する識別情報検出装置と、

前記識別情報検出装置によって検出される前記識別情報を記憶する識別情報記憶装置と、

前記スライドガラス検出装置の検出信号に基づいて、(1)前記スライドガラスの取り外し動作が検出された場合は、前記識別情報検出装置によって検出された前記スライドガラスの前記識別情報と、前記合焦位置検出装置によって検出された前記合焦位置とを関連づけて前記識別情報記憶装置に記憶し、(2)前記スライドガラスの装着動作が検出された場合は、前記識別情報記憶装置から、前記識別情報検出装置によって検出される前記スライドガラスの前記識別情報に対応する前記合焦位置を読み出し、読み出した前記合焦位置を前記合焦位置記憶装置に記憶する制御装置とをさらに備える。

10.請求項1に記載の顕微鏡システムは、

前記撮像装置によって撮像された前記画像のコントラスト値を検出する コントラスト検出装置をさらに備え、

前記合焦位置検出装置は、前記コントラスト検出装置によって検出される前記コントラスト値に基づいて、前記標本の前記合焦位置を検出する。

11. オートフォーカス装置は、

撮像装置と接続する接続部と、前記撮像装置は、顕微鏡のステージに搭載され、結像光学系を介して結像する標本の像を撮像して、撮像画像のコントラスト値を検出し、

前記接続部を介して取得される前記コントラスト値に基づいて、前記標本の合焦位置を検出する合焦位置検出装置と、

前記合焦位置検出装置によって検出された前記合焦位置を記憶する記憶 装置と、

前記記憶装置の記憶内容をリセットするためのリセット動作を検出する

リセット動作検出装置とを有し、

前記合焦位置検出装置は、(1)前記記憶部に記憶された前記合焦位置を中心としたサーチ範囲を設定し、設定した前記サーチ範囲で前記ステージを前記結像光学系の光軸方向に移動して新たに前記合焦位置を検出するような指令を出力し、(2)前記リセット動作検出装置によって前記リセット動作が検出されると、前記記憶装置の前記記憶内容を消去する。

### 12. 顕微鏡システムは、

標本の合焦位置を検出する合焦位置検出装置と、

前記合焦位置検出装置によって検出される前記合焦位置に関する情報を記憶する合焦位置記憶装置と、

前記合焦位置記憶装置に記憶された合焦位置情報に基づいてサーチ範囲を決定し、前記サーチ範囲内で合焦位置検出動作を行うよう前記合焦位置検出装置を制御するサーチ装置と、

前記合焦位置記憶装置に記憶された前記合焦位置情報をリセットするリセット装置と、

前記合焦位置情報が前記合焦位置記憶装置に一旦記憶されると、前記リセット装置が作動するまで前記合焦位置記憶装置に前記合焦位置情報を維持させる制御装置とを有する。

### 13.請求項12に記載の顕微鏡システムは、

前記標本を保持するスライドガラスの交換動作を検出するスライドガラス検出装置と、

前記スライドガラスに付与された固有の識別情報を検出する識別情報検 出装置と、

前記識別情報検出装置によって検出される前記識別情報を記憶する識別情報記憶装置とをさらに備え、

前記スライドガラス検出装置によって前記スライドガラスの取り外し動作が検出された場合、(1)前記制御装置は、前記識別情報検出装置によっ

て検出された前記スライドガラスの前記識別情報と、前記合焦位置検出装置によって検出された前記合焦位置情報とを関連づけて前記識別情報記憶装置に記憶し、(2)前記リセット装置は、前記合焦位置記憶装置の前記合焦位置情報をリセットし、

前記スライドガラス検出装置によって前記スライドガラスの装着動作が 検出された場合、前記制御装置は、前記識別情報記憶装置から、前記識別情 報検出装置によって検出される前記スライドガラスの前記識別情報に対応 する前記合焦位置情報を読み出し、読み出した前記合焦位置情報を前記合焦 位置記憶装置に記憶する。

14. 顕微鏡のオートフォーカス制御方法は、

ステージに搭載されたスライドガラス上の標本の像を撮像し、

撮像された前記標本の画像から、対物レンズに対する前記標本の合焦位置 を検出し、

記憶装置に前記合焦位置を記憶し、

合焦動作の開始が指示されると、前記記憶装置に記憶された前記合焦位置を中心としたサーチ範囲内で、前記ステージと前記対物レンズとを相対的に移動して新たに前記合焦位置を検出する。

15.請求項14に記載の顕微鏡のオートフォーカス制御方法は、

前記スライドガラスが前記対物レンズの光軸上から取り除かれると、前記記憶装置に記憶された前記合焦位置の情報を消去する。

# ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

本発明による顕微鏡システムは、標本を搭載するステージと、ステージに搭載された標本の像を形成する結像光学系と、結像光学系によって形成された標本の像を撮像する撮像装置と、撮像装置によって撮像された標本の画像に基づいて、標本の合焦位置を検出する合焦位置検出装置と、合焦位置検出装置によって検出された合焦位置を記憶する合焦位置記憶装置とを有する。合焦位置検出装置は、合焦動作を行うたびに、合焦位置記憶装置に記憶された合焦位置を中心としたサーチ範囲を設定し、設定したサーチ範囲でステージと結像光学系とを相対的に移動して新たに合焦位置を検出する。